

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣佈推出 X5.2™ 和 Teron™ 611 光罩檢測平台

積體電路廠進行光罩監測的 Total ReQual™ 解決方案

【加州 MILPITAS 2012 年 9 月 5 日訊】[KLA-Tencor 公司](#) (納斯達克股票代碼：KLAC) 今天宣佈，該公司為積體電路廠推出兩款新型光罩檢測產品：X5.2™ 和 Teron™ 611。作為成功的 5XX 系列的最新機型，新的 X5.2 具備極高效能，不僅能夠擷取目前生產中光罩上的缺陷與圖形退化，還能延伸至未來的 20 奈米節點。Teron 611 設計用於 20 奈米以下節點，透過技術提供領先的積體電路生產中所需的光罩檢測靈敏度。

KLA-Tencor 光罩產品事業部總經理熊亞霖博士說明：「新的清潔製程和光罩上的更小圖案特性改變了積體電路廠的光罩監測環境。20 奈米節點的主要和輔助圖形特性不僅更小，而且差異也變得模糊，更加難以判斷某個缺陷是否會影響晶圓上的圖形。我們的客戶也越來越擔心製程上因重複清潔與曝光造成光罩圖形退化的影響。我們已經設計出 X5.2 和 Teron 611 檢測系統，構成一套 Total ReQual™ 解決方案，對 20 奈米及更小節點的缺陷率和圖形退化進行監測。」

X5.2 和 Teron 611 的廣泛功能包括：

- 透過技術提供檢測 20 奈米節點最關鍵光罩所需的靈敏度 (Teron 611) ；
- 提供極高靈敏度給其餘的 20 奈米光罩和 28 奈米及更大設計節點的完整光罩組 (X5.2) ；
- 提早偵測清潔或曝光所造成的圖形退化，旨在製程崩潰點前提醒工程師；全面覆蓋多晶方與單晶方光罩的第五代 STARlight® 檢測模式；優先擷取圖形邊緣及側壁上的缺陷；並有效擷取開闊區域中的缺陷；
- 可有效辨別雜訊缺陷與關鍵缺陷 (DOI) 的先進演算法；

- 高度靈活的結構，允許調節靈敏度和速度，以適應積體電路廠推陳出新的產品組合、產品壽命週期和良率情況；
- 為先進設計節點提供業界領先產能的可選組態 (X5.2)；以及
- 與 KLA-Tencor 的 eDR-7000 電子束檢測平台獨特相連，提升對晶圓上的缺陷群進行特徵分析的速度與精準度。

X5.2 和 Teron 611 已經向美國及亞洲的領先晶片製造商出貨，並將用於 28 奈米和 20 奈米試產線。為了保持高效能與高產能，X5.2 和 Teron 611 系統由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務](#) 系統提供支援。關於 KLA-Tencor 的積體電路廠光罩檢測設備的更多資訊，請瀏覽產品網頁：
<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/rapid-ic-fab-series.html>。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor Corporation 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 X5.2 或 Teron 611 的預期效能，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 X5.2 或 Teron 611 產品的預期使用，X5.2 或 Teron 611 提供新功能的預期可擴展性，以及 X5.2 或 Teron 611 使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。基於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此聲明中的預計結果實質不同。

###